

投标MTBF可靠性检测报告 MTBF寿命测试

产品名称	投标MTBF可靠性检测报告 MTBF寿命测试
公司名称	信达检测技术（深圳）有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田村新时代工业区七号
联系电话	13510588137 13510588137

产品详情

MTBF 连续无故障运行时间测试 MTBF寿命测试 MTBF寿命试验 可靠性测试MTBF报告 MTBF报告赛宝 MTBF报告威凯 MTBF报告赛西

赛宝MTBF报告快速发证 MTBF报告10万小时赛宝 MTBF报告5万小时赛宝 MTBF报告10万小时威凯 MTBF报告10万小时泰瑞特 MTBF报告10万小时赛西 平均无故障连续运行时间MTBF测试 MTBF平均无故障连续运行时间试验 可靠性测试MTBF报告

寿命试验可以对产品的可靠性水平进行评价，并通过质量反馈来提高新产品可靠性水平。在合适工作条件下器件使用寿命期内的故障率很低。电子元器件的寿命，与工作温度是有密切关系的。以电脑主板上常用的也常出故障的电解电容器为例，其寿命会受到温度的影响。

因此，应尽可能使电容器在较低的温度之下工作，如果电容器的实际工作温度超过了其规格范围，不仅其寿命会缩短，而且电容器会受到严重的损毁（例如电解液泄漏）。

寿命试验（MTBF）方法分为定时截尾试验，定数截尾试验，估算方法为：平均寿命的点估计值、单侧置信下限估计、双侧区间估计。高温工作寿命试验高温寿命试验为利用温度及电压加速的方法，藉短时间的实验来评估IC产品的长时间操作寿命。

MTBF寿命测试

一般常见的寿命实验方法有

BI (Burn-in) /EFR (Early Failure Rate)

HTOL (High Temperature Operating Life)

TDDDB (Time dependent Dielectric Breakdown

对于不同的产品类别也有相对应的测试方法及条件，如

HTGB (High Temperature Gate Bias)

HTRG (High Temperature Reverse Bias)

BLT (Bias Life Test)

Intermittent Operation Life等。

低温工作寿命试验低温操作寿命试验为利用低温及电压加速的方法，评估该组件于低温环境操作下的寿命。温度工作寿命检测能力GJB899-2009